

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ランチョンセミナー

満を持して登場！
真の姿に迫る高分解能電子顕微鏡
「Spectra」の発表

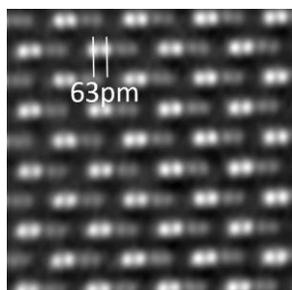
演者: ブライト アレクサンダー



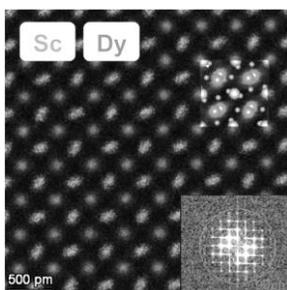
サーモフィッシャーサイエンティフィックから、最新型収差補正走査透過型電子顕微鏡 (STEM) 「Spectra」がついに登場しました。これまで好評だった Titan / Themis シリーズの特長に加えて、さらに高い性能を有しています。今回のランチョンセミナーでは、この最新の高スループット、高分解能システム「Spectra」のアプリケーションについてご紹介します。

<特長>

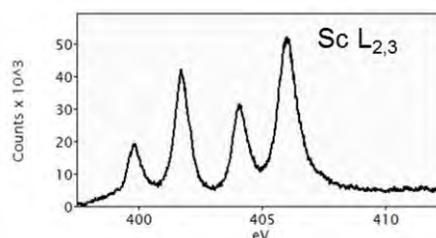
- STEM 保証分解能 <50 pm
- 究極の高輝度かつ低エネルギーばらつきの新型 X-CFEG
- S-CORR 5次収差 STEM 補正器
- 新型 Panther STEM 検出器は単電子を検出する感度を有し、これまでにない低ドーズイメージング
- ソフトウェアの進歩: Velox UI, OptiSTEM+, OptiMono+ といった自動機能により原子分解能情報をより容易に取得



IDPC-STEM lattice image of the <112> zone axis of GaN, showing the Ga (white) and N (grey) atom columns with <63pm resolution



Unfiltered atomic EDX map of DyScO₃ taken with Spectra 200, X-CFEG, S-CORR and large solid angle (1.76 Sr) DualX detector



High resolution EELS spectrum of the Sc L_{2,3} edge of DyScO₃ using the X-CFEG, 0.36eV energy resolution, 480pA probe current and <70pm probe size

詳細は、 www.thermofisher.com/Spectra200

日本エフイー・アイ株式会社
Eメール: JPTOK.sales-jp@thermofisher.com
電話: 03-3740-0970